EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

03180023 **PUBLICATION NUMBER** 06-08-91 **PUBLICATION DATE**

08-12-89 APPLICATION DATE APPLICATION NUMBER 01319532

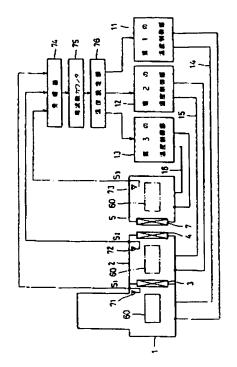
APPLICANT: MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR: KUSUSE HARUHIKO;

H01L 21'027 INT.CL.

: TEMPERATURE CONTROLLING TITLE

METHOD IN ALIGNER



ABSTRACT: PURPOSE: To make the temperature of a sample holder constant by providing a constitution wherein the differences in measured temperature values of a sample holder in the inside of a reciprocating work chamber, in the inside of a load lock and at the outside of an apparatus are located within a specified allowable range.

> CONSTITUTION: A sample holder 60 is reciprocated between a sample holder storing part 5 at the outside of an apparatus and a work chamber 1 through a load lock 2. The temperature of the sample holder 60 in the work chamber 1, in the load lock 2 and in the sample holder storing part 5 are measured, respectively. The temperatures in the work chamber 1 and in the load lock 2 are controlled by second and third temperature controlling parts 12 and 13 so that the difference in measured values is located within a specified allowable range. In this way, the sample holder 60 can be kept at the approximately constant temperature accurately.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-180023

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)8月6日

H 01 L 21/027

7013-5F H 01 L 21/30

341 L

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

60発明の名称

露光装置における温度制御方法

②特 願 平1-319532

②出 願 平1(1989)12月8日

⑫発 明 者 楠 瀬

治彦

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

勿出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

明 細 音

1. 発明の名称

露光装置における温度制御方法

2. 特許請求の範囲

前記露光処理に先立って、前記試料ホルダを前記ロードロックを経由して装置外部と前記ワークチャンパとの間を往復移動させながら、前記ワークチャンパ内、前記ロードロック内および装置外

部における前記試料ホルダの温度をそれぞれ測定し、それらの測定値の差が一定の許容範囲内になるように、前記第 1 および第 2 の温度制御部を制御することを特徴とする露光装置における温度制御方法。

3. 発明の詳細な説明

(産衆上の利用分野)

この発明は、試料を試料ホルダによって保持しながらロードロックを経由しワークチャンバに 撤送・位置決めした後、 第光ビームをその試料に 話光 地理前に試料ホルダの温度を一定にするための温度制御方法に関する。

〔従来の技術〕

第4図は従来の電子ピーム電光装置を示すプロック構成図である。 同図に示すように、電子ピーム電光装置には試料 (図示省略)に電子ピームを照射するためのワークチャンバ1と、ワークチャンバ1に連結されたロードロック 2 とが設けられている。また、ワークチャンバ1とロードロック

特開平3-180023(2)

したがって、はれがはれたルダ6にセットされたのに続いて、位置使め指令が制御部(図示省略)から与えられると、はれてルダ6は試料を保持しつつゲートで、4を適適して、ロードロック2に撤送される。さらに、それに続いて、試料ホルダ6がゲート3を介してワークチャンバ1の所定位置に搬送されては料が位置使めされる。

そこで、第4図に示すように、ワークチャンパ1. ロードロック 2 およびは料ホルグ保セン 8 ~ 1 のが设けられるとともに、それの温度を加まるに、第3の温度は制御の1 1 ~ 1 3 にそれでようれてクチャンの温度に関係するには料ホルグ保管部5 を中には対してカークをである。 は、ロードロック 2 およびは料ホルグ保管部5 をではない 1 の 2 およびは料ホルグ保管部5 をそれでれ加熱/冷却する。

しかしながら、上記装置ではワークチャンの温度ではワークを部ちているという。 といば料ホルグ保 各部が でるれぞ との 御定結果に基準する ここと では 料ホルグ 6 を間接的に一定 温度 を 直接 的に 温度 を 直接 的に 温度 を でいない。 したがって、 は料ホルグ 6 の 温度 は のに 限界があり、 は は ホルグ 6 の 温度 く

その後、露光開始指令が与えられると、ワーク チャンパ 1 内で試料に電子ビームが照射露光される。

[発明が解決しようとする課題]

ところで、従来より周知のように、露光処置中 においては試料を常に所定位置に固定しておく必 要がある。特に、上記露光装置では試料を試料ホ ルダ6に保持したまま電子ピームを照射して弱光 処理を行っているので、試料ホルダ6に大きな温 皮変化が与えられないようにする必要がある。と いうのも、例えば試料ホルダ保管部ちが比較的低 温であり、そのは料ホルダ保育部5に長時間保管 されていた試料ホルダ6がロードロック2を経由 して比較的高温のワークチャンバ1に移送された 時、 ワークチャンパ 1 への 搬 送 直後において は は 料ホルダ6は試料ホルダ保管部5の温度に近い値 を示しているが、時間の経過につれて試料ホルダ 6の温度が徐々に上昇する。その結果、試料ホル ダ6が熱膨脹しては料の位置ずれを生じさせるこ とがある。

一定に保つことが困難である。

この発明は上記のような問題を解消するためになされたもので、は料ホルダの温度を特度良く所定の温度に制御することができる電光装置における温度制御方法を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

特開平3-180023 (3)

ンパとの間を往後移動させながら、前記ワークチャンパ内。前記ロードロック内および装置外部における前記試料ホルダの温度をそれぞれ測定し、それらの測定値の差が一定の許容範囲内になるように、前記第1および第2の温度制御部を制御している。

(作用)

(実施例)

第2図はこの発明にかかる温度制御方法を適用可能な露光装置の構成を示すプロック構成図であり、第3図はは料ホルダの構成を示すプロック構

受信アンテナ71~73によって受信された各信号S1. S2, S3 は受信器74に与えられてFM復調された後、周波数カウンタ75によってその周波数がカウントされる。こうして、試料ホルダ61の温度を直接的に副定し、その温度に対応したカウント値が温度は、従来のに出力される。なお、その他の構成は、従来では、第4図)のそれと同一であるために、ここでは同一または相当部分に相当符号を付してその説明を省略する。

次に、この発明にかかる温度制御方法の一実施別について第1図を参照しつつ説明する。まず、 は料への電子ビーム照射(鑑光処理)に先立って、オペレータがキーボード(図示省略)を介してワークチャンバ1、ロードロック2およびは料ホルダ保管部5の初期温度 T ₁ 、 T ₂ 、 T ₃ を 入力する。なお、入力された値 T ₁ 、 T ₂ 、 T ₃ は温度 没定部76のメモリ(図示省略)に記憶される。

そして、温度制御開始の指令が装置全体を制御 する制御部(図示省略)から与えられると、温度 一方、ワークチャンパ1、ロードロック2およびは料ホルダ保管部5には、受信アンテナ71~73がそれぞれ设けられており、各部に移動してきたは料ホルダ部60から送信される信号を受信することができるように構成されている。また、

設定部76から第1ないし第3の温度制御部11 ~13に初期温度値T₁、T₂、T₃が出力され て、第1ないし第3の温度制御邸11~13が各 温度センサ8~10から出力される信号をフィー ドバックしながら各部の温度を上記設定温度にな るように斜御する(ステップST1)。それに統 いて、試料ホルダ61の原点位置たる試料ホルダ 保管部5に位置決めされている試料ホルダ郎60 (第2図の2点鎮線) の試料ホルダ61の温度が 温度センサ62により直接的に測定される(ステ ップST2)。その測定結果は、上紀のようにし てその温度に対応するカウント値T_{ag}に変換され て、温度設定部76のメモリに記憶される。なお、 温度測定にあたっては、試料ホルダ61の温度が は料ホルダ保管部ちのそれと平衡状態になるのを 待って測定する。また、後で説明する温度研定時 (ステップST4、ST6) にも上記と同様にし て別定を行うようにする。

次に、は料を保持しないままは料ホルダ部60 が搬送機構部(図示省略)によりゲート7、4を

特開平3-180023 (4)

介してロードロック 2 に搬送される (ステップ S T 3)。 そして、ロードロック 2 に位置決めされたは料ホルダ節 6 0 (第 2 図の 1 点頻線) のは料ホルダ 6 1 の温度が測定されて (ステップ S T 4)、上記と同様に、その温度に対応するカウント値T。2が温度設定部 7 6 のメモリに記憶される。

さらに、は料ホルダ部 6 0 がゲート 3 を介してワークチャンパ 1 に 撤送された (ステップ S T 5)後、そのワークチャンパ 1 に位置決めされたは料ホルダ部 6 0 (第 2 図の実線)の 試料ホルダ 6 1の温度が測定されて (ステップ S T 6)、 その削定結果 T al が温度设定都 7 6 のメモリに記憶される。

上記のようにして、各部における試料ホルダ 6 1 の温度が削定されると、試料ホルダ 部 6 0 はまずロードロック 2 に搬送され(ステップ S T 7)、続いて試料ホルダ保管部5 に順次搬送される(ステップ S T 8)。そして、温度設定部 7 6 において、そのメモリに記憶されている値を読み出し、次式

なお、上記のようにして、試料ホルダ 6 1 の 温度制御が完了すると、試料ホルダ 6 1 に 試料が保持された後、ロードロック 2 を経由してワークチャンパ 1 に搬送・位置決めされる。 そして、電子ビームが照射されて露光処理が実行される。

以上のように、は料ホルダ61の温度を直接的に削定して、その温度がほぼ一定になるように制御しているので、は料ホルダ61の熱膨脹はほと

 $\Delta T_{12} - T_{m2} - T_{m1}$ $\Delta T_{13} - T_{m3} - T_{m1}$

にしたがってワークチャンバ1とロードロック 2 とにおける試料ホルダ 6 1 の温度差 Δ T ₁₂およびワークチャンバ1と試料ホルダ保管部 5 とにおける試料ホルダ 6 1 の温度差 Δ T ₁₃がそれぞれを求められ、その差 Δ T ₁₂ Δ T ₁₃が ともに予め設定されている基準値未満であるか否かが判断される(ステップ S T 9)。

ステップ S T 9 において、差 Δ T 12. Δ T 13の うち少なくとも一方が猛準値未満でない(すなわち 基準値以上である)と判断されると、さらに温度設定部 7 6 において、再設定温度 T 2 ′. T 3 ′が下記の式に基づいてそれぞれ演算されて、ロードロック 2 . 試料ホルダ保管部 5 の温度として初期温度 T 2 ′. T 3 ′が再設定される(ステップ S T 1 C)。

 $T_{2}' = T_{2} + (T_{a2} - T_{a1})$ $T_{3}' = T_{3} + (T_{a3} - T_{a1})$

んとなくなり、 は料ホルダ61の 熱膨脹によるは 料の位置ずれを防止することができる。

なお、上記実施例では、温度センサ 6 2 により 測定した値を温度設定部 7 6 に送るために、無線による送受信システムを利用したが、この代わりに前置アンブ 6 3 から出力された電圧 号にに対応するディジクル信号に変換して一時的に試料ホルダ 6 0 内の 記録手段 (例えばメモリ素子) に記録し、外部に取り出したでもよびデータを温度設定部 7 6 に与えるようにしてのよい。また、前置アンブ 6 3 を直接温度設定部 7 6 に電気的に接続してもよい。

また、上記実施例では、ロードロック 2 および 試料ホルダ保管部 5 の温度を再設定しているが、 これに限定されるものではなく、ワークチャンパ 1 およびロードロック 2 の温度を、あるいはワー クチャンパ 1 および試料ホルダ保管部 5 の温度を 所設定するようにしてもよい。

また、上記実施例では、試料ホルダ保管部5を 扱け、試料ホルダ部60を一時的に保管するよう

特開平3-180023 (5)

にしているが、は料ホルダ保管部5を設けない場合、すなわち電光装置の外部では料ホルダには料をセットし、ロードロックを経由してワークチャンパに機送し、所定位置に位置決めした後、 露光ビームをそのは料に照射して露光処理を行う場合にも、本発明を適用することができる。

さらに、上記実施例では、この発明を電子ピーム露光装置に適用した場合について説明したが、 露光装置全般に適用することができることは言う までもない。

(発明の効果)

以上のように、この発明によれば、は料ホルダをロードロックを経由して装置外部とワークチャンパ内、前記ロードはながら、前記ワークチャンパ内、前記ロードクの温度をそれぞれ直接を囲かったのがでは、前記ないで、前記は料ホルダの温度が第2の温度を精度良くほぼ一定に保つことができる。

4. 図面の簡単な説明

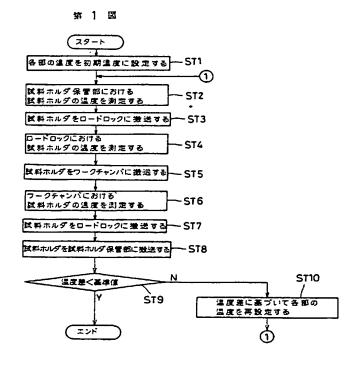
第1図はこの発明にかかる温度制御方法の一実施例を示すフローチャート、第2図はその温度制御方法を適用可能な露光装置のプロック構成図、第4図は 第3図はは料ホルダのプロック構成図、第4図は従来の露光装置のブロック構成図である。

図において、1はワークチャンパ、2はロードロック、11は第1の温度制御部、12は第2の温度制御部、61は試料ホルダである。

なお、各図中同一符号は同一または和当部分を示す。

第 3 図

代理人 大岩塘雄

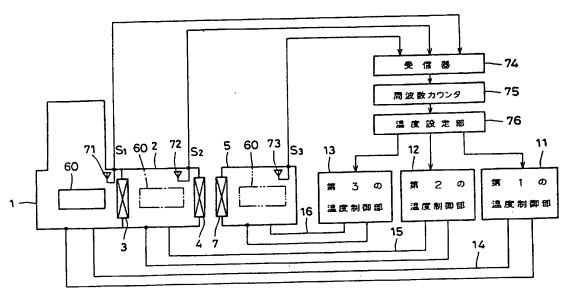


61… 試料ホルダ

-115-

特開平3-180023 (6)

第 2 図



1…ワークチャンパ 2…ロードロック 11…第1の温度制御部 12…第2の温度制御部

